附表一

**XPS樣品檢測申請書**

申請日期:\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 編號:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託者姓名: 委託者英文姓名:  服務單位: 單位主管:  聯絡電話: 分機: 手機:  電子信箱: 聯絡地址:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  樣品說明: 件數: 繳費方式：□現金繳費□支票、郵政匯票□匯入學校帳戶 | | | | | | |
|  | 樣品1 | 樣品2 | 樣品3 | 樣品4 | 樣品5 | 樣品6 |
| 名稱或代號 |  |  |  |  |  |  |
| 導電性 | □良好□不好 | □良好□不好 | □良好□不好 | □良好□不好 | □良好□不好 | □良好□不好 |
| 化學組成 |  |  |  |  |  |  |
| 表面結構（表面是否粗糙） |  |  |  |  |  |  |
| 具輻射性 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
| 具磁性 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
| 具毒性 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
| 具揮發性 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |
| 真空系統污染(是/否)及措施 |  |  |  |  |  |  |
| 觀察部位 |  |  |  |  |  |  |
| 樣品(是/否)會互相污染 |  |  |  |  |  |  |
| 樣品型態（薄膜、粉體、塊材…） |  |  |  |  |  |  |
| **測試項目 (可複選)** | | | | | | |
| 1.XPS全能譜掃描  (註明範圍) |  |  |  |  |  |  |
| 2.XPS單元素能譜圖  (註明元素) | * 元素: | * 元素: | * 元素: | * 元素: | * 元素: | * 元素: |
| 3.成份縱深分析 (請送件人告  知結構並告知要縱深分析到什  麼程度，如:Al(20nm)/  SiO2(100nm)/Si基板，  看到Si基板訊號即可停止)。 | □Ar □C60  元素: | □Ar □C60  元素: | □Ar □C60  元素: | □Ar □C60  元素: | □Ar □C60  元素: | □Ar □C60元素: |
| 4. 預Sputter (註明min) |  |  |  |  |  |  |
| 5.Angle resolved analysis  (註明角度) |  |  |  |  |  |  |
| 6.SEI image二次影像截取 |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |

備註：

* 1. 請詳閱X光光電子能譜儀(XPS)預約與管理辦法。
  2. 請在送測樣品寄達貴儀中心後，儘快與技術人員接洽(操作人員：魏經理, email: [yjwei2020@mail.mcut.edu.tw](mailto:yjwei2020@mail.mcut.edu.tw), 電話：02-2908-9899#4390)。
  3. 樣品至少需抽半小時以上才能移入真空腔體。